損傷スケールと観察手法



cm

mm

 μ m (マイクロメートル: 10^{-6} m)

nm(ナノメートル: 10⁻⁹m)

透過型電子顕微鏡(TEM):2,000~1,500,000倍

目視検査:1倍

実体顕微鏡:数倍~50倍

光学顕微鏡:25~1,000倍

走査型電子顕微鏡(SEM):40~50,000倍



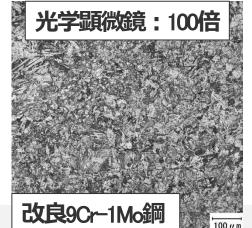


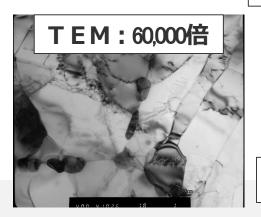






※当社では、走査 型電子顕微鏡観 察まで可能。それ 以上の観察は、別 途、依頼を実施。





TEM画像出典: あら産業科学技術総合セターHP